

第3日目：6月16日（水）

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

<b>A会場</b>	2F 大ホール	S-1 国際シンポジウム:アジアにおける先端電子顕微鏡研究の最前線 9:00~12:15		S-1 国際シンポジウム:アジアにおける先端電子顕微鏡研究の最前線 13:15~17:25	
		S-8 ナノテクノロジープラットフォーム・微細構造解析プラットフォーム10年間の活動と成果 9:00~11:30		S-8 ナノテクノロジープラットフォーム・微細構造解析プラットフォーム10年間の活動と成果 13:00~15:30	
<b>B会場</b>	2F 中ホール200	B-2 微生物・細胞・組織観察/試料作製 9:00~12:00		S-6 非晶質凍結した含水性試料におけるクライオSEM法の最前線 13:00~17:00	
		I-4 各種位相法 9:30~11:45		M-8 その場観察・環境制御 13:00~16:15	
<b>C会場</b>	3F 中ホール300	I-8 その他（装置・手法系） 9:00~11:45		I-2 SEM 13:00~14:15	
		S-15 観察・加工装置としての最先端FIBSEMの技術動向 9:00~11:45		M-1 金属 14:30~16:15	
<b>D会場</b>	2F 中会議室201	S-11 電子波干渉を利用した顕微法の最先端 13:00~17:00			
		S-11 電子波干渉を利用した顕微法の最先端 13:00~17:00			
<b>E会場</b>	2F 中会議室202				
<b>F会場</b>	1F 大会議室101				
<b>G会場</b>	4F 小会議室405				